

## ElektroPhysik advancing with technologies



### Tekniske data

MiniTest 4100-1100 serien repræsenterer det store flexible system af apparater med forskellige muligheder for dataopsamling og -behandling, ligesom det store udvalg af sonder muliggør måling på mange lag/basissubstrat kombinationer og geometiske udformninger.

**MiniTest 4100** kan lagre 10.000 måleværdier, som kan gemmes i op til 99 applikations-filer hver med op til 98 batches.

Applikationshukommelsen er ekstrem nyttig når der er behov for hyppigt at skulle kalibrere sonderne på forskellige materialer og emneudformninger. De forskellige emner/typer/kalibreringer gemmes simpelthen i applikationsfilerne og kan hurtigt kaldes op for brug. Der er mulighed for statistisk evaluering af måledata lige som der er toleranceovervågning med akustisk alarm m.v.

**MiniTest 3100** svarer til ovenstående, med hukommelseskapacitet på 10.000 måleværdier, som kan gemmes i op til 10 applikations-filer hver med op til 10 batches.

MiniTest 2100 har en hukommelseskapacitet på 10.000 måleværdier, som kan gemmes og evalueres statistisk, lige som værdierne kan transmitteres til MiniPrint 4000 eller PC for videre arkivering eller databehandling.

**MiniTest 1100** er basisversionen, som i lighed med de ovenstående er beregnet til udførelse af præcise målinger. Der er blot ingen hukommelse for lagring af måleværdier.

## MiniTest 4100 - 3100 - 2100 - 1100 lagtykkelsesmålere

### Ikke destruktiv lagtykkelsesmåling:

Sondeprogrammet omfatter et stort antal forskellige udførelser:

Magnetinduktive (F) sonder benyttes til måling af alle umagnetiske lag som fx. lak, emalje, krom, kobber, zink på almindelig stål.

Hvirvelstrømssonder (N) anvendes ved måling af alle isolerende lag som fx. lak, kunststof og eloxering på alle ikke ferritiske metaller.

FN-sonderne arbejder efter både magnetinduktiv- og hvirvelstrømsmetoden og kan derfor måle på såvel ferittiske som ikke ferittiske metaller.

<b>FN 1.6</b>	0 ... 1600 µm høj opløsning, 0,1 µm
<b>FN 1.6P</b>	0 ... 1600 µm på uhærdede pulverlag
<b>FN 2</b>	0 ... 2000 µm
<b>F 05</b>	0 ... 500 µm høj opløsning, 0,1 µm
<b>F 1.6</b>	0 ... 1600 µm
<b>F 3</b>	0 ... 3000 µm
<b>F 1.6/90</b>	0 ... 1600 µm høj opløsning, 0,1 µm
<b>F 2/90</b>	0 ... 2000 µm
<b>F 10</b>	0 ... 10 mm
<b>F 20</b>	0 ... 20 mm
<b>F 50</b>	0 ... 50 mm
<b>N 02</b>	0 ... 200 µm høj opløsning, 0,1 µm
<b>N. 08Cr</b>	0 ... 80 µm for ekstremt kromlag på Cu, Al eller messing.
<b>N 1.6</b>	0 ... 1600 µm høj opløsning, 0,1 µm
<b>N 2</b>	0 ... 2000 µm
<b>N 1.6/90</b>	0 ... 1600 µm lang vinkelsonde til måling i spalter el. rør
<b>N 2/90</b>	0 ... 2000 µm lang vinkelsonde til måling i spalter... el. rør
<b>N 10</b>	0 ... 10 mm
<b>N 20</b>	0 ... 20 mm
<b>N 100</b>	0 ... 100 mm
<b>CN 02</b>	10 ... 200 µm fx Cu på isolerende materialer